

 <p>Pôle de Chéraga</p>	<h2 style="text-align: center;">Microscope Electronique à Balayage MEB</h2>
<p>Marque : Zeiss Model : GEMINI SEM 300</p>	
<p>Description de la technique</p>	<p>L'imagerie MEB consiste en une génération d'image et une analyse d'échantillon à l'aide d'un faisceau d'électron focalisé qui balaye l'échantillon.</p>
<p>Analyses / essais/ Mesures effectués</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse par Energy Dispersive Spectroscopy (EDS). • Contraste topographique par électrons secondaires SE. • Contraste chimique des phases par électrons rétrodiffusés BSE. • Analyse par Electron BackScattered Diffraction (EBSD) : réalisation des Cartes d'orientation cristallographique des grains d'un matériau, la texture du matériau, les tailles de grains.
<p>Contact</p>	<p style="text-align: center;">dep.valorisation@crti.dz</p>